JEOL 6460LV

RESUMEN

CATEGORÍA — Microscopio Electrónico de Barrido de Bajo Vacío.

TÉCNICAS

- Microscopía electrónica de barrido
- Alto y bajo vacío
- EDX

RESPONSABLES — Cristina Vaquero // Juan Luis Ribas.

LOCALIZACIÓN — Edificio CITIUS, Planta Baja, Ala Derecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de cañón: emisión termoiónica.
- Condiciones de trabajo:

Modo	**Alto Vacío**	**Bajo Vacío**
Resolución	3 nm (a 30kV)	4 nm (a 30kV)
Voltaje Aceleración	0.3 - 30 kV (paso 100 V)	
Aumentos	10X – 200.000X	
Cámara de vacío	10^{-5} Pa	10 a 270 Pa
Modos de Imagen	BSE (Electrones Retrodispersados) • Imagen composicional (BEC) • Imagen topográfica (BEW) • Imagen estereoscópica (BES) SEI (Electrones Secundarios)	BSE (Electrones Retrodispersados) • Imagen composicional (BEC) • Imagen topográfica (BEW) • Imagen estereoscópica (BES)
Posibilidades de movimiento	X: 0 a 125 mm // Y: 0 a 100 mm // Z: 5 a 80 mm	
	T: -10º a 90º // R: 360º	
Requisitos de la muestra	Tamaño: 20mm x 20mm	
	Naturaleza: conductora	Naturaleza: Sin restricción
	Masa < 1 Kg	
Microanálisis	Análisis puntual	
	Análisis área	
	"Mapping"	
Accesorios	Dedo Frío. Hasta -25ºC	
	Portamuestras hasta 2 muestras	Portamuestras hasta 2 muestras
	Portamuestras hasta 7 muestras	

- Filamento: Tungsteno.
- Detectores:
    - E. Secundarios. Configuración Everhart-Thornley. Material destellante.
    - E. Retrodispersados. Configuración Everhart-Thornley. Material semiconductor (unión P-N)
    - Microanálisis (EDS). Si(Li). Oxford Instruments INCA x-sight. Modelo: 7573. Ventana: ATW2.

- Análisis de imagen.
- Adquisición de imágenes en formato TIF, JPG y BMP.
- Movimiento de la muestra motorizado en 5 ejes.